

DPI mit integrierter Strom- und Spannungsmessung

Kurzbeschreibung

Um die Resistenz von integrierten Schaltkreisen (IC) gegenüber HF-Störungen zu ermitteln, sind spezielle Testverfahren erforderlich. Es müssen definierte HF-Störgrößen über definierte Netzwerke in den IC eingekoppelt werden.